データセットおよび試料情報等の確認・編集方法

- エンバーゴ期間終了日を過ぎたデータセットは、ARIMデータポータルサイト (<u>https://nanonet.mext.go.jp/data_service/</u>)で公開されます。
- データセット品質向上にご協力のほど、よろしくお願いいたします。
 (確認事項)
 - 1. データセット情報
 - 2. データセット管理者情報
 - 3. 試料情報(DOI付与の場合は必須)

※詳細は、データカタログ作成要綱をご参照願います。





データセット登録者(所属機関):MATSUNAMI,Shigeyuki(NIMS) KIMOTO,Koji(NIMS)

measured using a monochromator whose energy resolution is less than

0.2 eV.



エンパーゴ解除日: 2023.10.31 データセットID: fa4a4d80-567a-4ec0-a43d-5789b2a7ee3f データタイル数: 10 ファイル数: ファイルサイズ: 15.26MB

成果発表・成果利用

装置・プロセス

データインデックス

登録日: 2023.10.26

1. データセットの編集

1-1 RDEデータ閲覧アプリへのアクセス

- RDEのデータ閲覧アプリ(<u>https://rde.nims.go.jp</u>)にブラウザでアクセス
- DICEアカウントでログイン

1-2 データセットの選択

データセット名をクリック

データセット一覧		
データセット名、データセット説明	1、課題番号、課題名、装置名、装置ローカルI	グループ閲覧・データセット開設▼ ID、データセット管理者名、試料名、タグなどを入力してくだ Q
JPMXP1222MS5027 · MS-	202	データー覧 2
概要		氏名及び組織名が正確に記載され
50		ていること。修正方法は(2. DICE
テーダセット種別 データセット管理者(所属)	▲ (協連解析・リノアレンズ型Keiichi Nakamoto (分子科学研究所)	アカワント情報の確認・編集 <i>)</i> を ご参照ください
課題番号	JPMXP1222MS5027	
最終更新日時	2023-09-14 16:30:10 JST	

1-3 データセット詳細画面

•

「編集」ボタンをクリック

データセット詳細: JPMXP1222MS5027・MS-202			
データセット削除現在表示されているデータセットは未リリースです。	データー覧 2		戻る
データセット基本情報 データカタログ メタデータ項目リスト	利用履歴		
編集		全体	表示中 のVer.
データセットID a378e0de-de73-4f23-b365-ba83676100d8 事業 マテリアル先端リサーチインフラ事業	データ セット	40	40
課題番号 JPMXP1222MS5027 課題名 AFM液中電気化学電極評価	閲覧数	0	0
データセット開設者(所属) Keiichi Nakamoto (分子科学研究所) データセット管理者(所属) Keiichi Nakamoto (分子科学研究所)	ゼット ダウン ロード		
_{データセットの都} 編集ボタンが表示ない場合は、 _{関連データセッ} 下記権限を持つDICEアカウントでログイ	インして	くだ	さい。
_{データセット引用の1} ・データ所有者 ・データセット管理者 ^{励 (合わt} ・研究チーム管理者)			

1. データセットの確認・編集

1-4 データセット基本情報の編集

編集後、画面下部の「保存」ボタンをクリック

データセット基本情報編集:JPMXP1222MS5027・MS-202				
データセットID a378e0de-de73-4f23-b365-ba83676100d8				
事業 マテリアル先端リサーチインフラ事業				
課題番号 🚳 JPMXP1222MS5027 🗸				
課題名 AFM液中電気化学電極評価				
データセット開設者(所属) Keiichi Nakamoto (分子科学研究所)				
データセット管理者(所属) 🐼 Keiichi Nakamoto (分子科学研究所) 🗸				
 データセット名 630 JPMXP1222MS5027・MS-202 				
2 データセットの説明 データセットの説明を入力してください。				
 ●連情報追加 データセット名 ・データセットの内容に適したタイトルであること。 ・日本語で50文字程度以内(英語の場合は100文字程度以内) データの説明(ARIMデータポータルサイトの要約に記載されます) ・データセットの内容が理解できる説明文(利用報告書の要約でも可)。 ・日本語の場合は200文字以上(英語の場合は400文字以上) 				
データセット引用の書式 データセット引用の書式を入力してください。				
間い合わせ先を入力してください。				
保存キャンセル				

2. DICEアカウント情報の確認・編集

- DICE利用者ポータルにアクセス <u>https://diceidm.nims.go.jp/csp/csp-user-portal/</u>
- DICEアカウントでサインイン
- 情報修正し「保存する」をクリック

DICE Materials data platform		
	DICE 利用者ポータル	
	アプリケーション プロフィール パスワード 多要素認証 退会手続き	
	☆ ユーザID	
	¢ DICE-ID	
1	✿ 表示名 ③	
	✿ 姓(アルファベット) ⑧ ◎◎	
	 漢字表記か英語表記で入力 ◆ ^{▲(アルファベ} 例:漢字表記:山田 大郎 	
	✿ _{姓(漢字)} ① 英語表記:YAMADA, Taro	
	^{✿ 姓(ヵナ)} [●] ・姓(漢字/カナ)・名(漢字/カナ)も可能な限 ⁽	り入力
	✿ _{名(カナ)} ❶ (お問い合わせなどに必要なため)	
	✿ 在住国 🚺 🛛 🐼 Japan 🗢	
_	✿ 国籍 1 🛛 🖉 Japan 🔶	
2	✿ 所属機関 ③	
	✿ 部署名 ⑤	
	ORCID (1)	
	✿ e-Rad研究者番号 ①	
	♀ researchmapリンク識別子 ()	
	■保存する	
	アプリケーション プロフィール パスワード 多要素認証 退会手続き	
	プロフィールの更新が完了しました。	

3. 試料情報の編集

3-1	RDEデータ閲覧アプリへのアクセス(省略、同1-1)
3-2	データセットの選択(省略、同1-2)
3-3	データー覧の選択
• -	データセット詳細画面の「データー覧」をクリック
	データセット詳細:JPMXP1222MS5027・MS-202
3	データセット削除 データー覧 2 戻る
ŧ	データセット基本情報 データカタログ メタデータ項目リスト 利用履歴

全体

表示中

3-4 試料名(ローカルID)の選択

データセットID a378e0de-de73-4f23-b365-ba83676100d8

 データー覧画面で「試料名(ローカルID)のリンク」をクリック または、データ詳細画面の[メタ情報] ー [試料情報]の試料名をクリック

テーター見: JPMXP122	2MS5027 · I	MS-202				
				データセット詳	⊞ デ	ータセット一覧へ戻る
					登録日	時 🗸 🔾 昇順 🖲 降順
Au Surface on Mica 🕑	2	Sputtered Au thin fiside wall	lm on Mica substrate 1			
		and the second	23			
504 30 9mm 120.04 5E		データ詳細:JPMXP122	22MS5027 • MS-202 : A	u Surface on Mica		
	2.00um	メタ情報				
デーク所有者(所属)	2.00um	メタ情報	日本語名	英語名	単位	億1
データ所有者(所属) Keiichi Nakamoto (分子科学研究所)	2 Dûum	メタ情報 分類 基本情報	日本語名記入年月日	英語名 Date of Data Entry	単位	備1 2023-10-02 JST
データ所有者(所属) Keiichi Nakamoto (分子科学研究所) 試料名(ローカルJD) Sputtered Au thin film on Mica	2 00um	メタ情報 ^{分類} 基本情報	日本語名 記入年月日 データ所有苞(所篇)	英语名 Date of Data Entry Data Owner (Affiliation)	単位	值1 2023-10-02 JST Kelichi Nakamoto (分子科学研究 所)
データ所有者(所属) Keiichi Nakamoto (分子科学研究所) 試料名(ローカルJD) Sputtered Au thin film on Mica 説明	2 00um	メタ情報 分類 基本情報	日本語名 記入年月日 データ所有者(所篇) データ名	英語名 Date of Data Entry Data Owner (Affiliation) Data Name	単位	2023-10-02 JST Keiichi Nakamoto (分子科学研究 所) Au Surface on Mica
データ所有者(所属) Keiichi Nakamoto (分子科学研究所) 試料名(ローカルJD) Sputtered Au thin film on Mica 説明	2 00um	×夕情報 分類 菱本情報	日本語名 記入年月日 データ所有苞(所篇) データ名 実験LD	英語名 Date of Data Entry Data Owner (Affiliation) Data Name Experiment ID	単位	値1 2023-10-02 JST Keiichi Nakamoto (分子科学研究 所) Au Surface on Mica
データ所有者(所属) Keiichi Nakamoto (分子科学研究所) 試料名(ローカルID) Sputtered Au thin film on Mica 説明	2 00um	メタ情報 分類 基本情報	日本語名 記入年月日 データ所有意(所篇) データ名 実験ID 説明	英語名 Date of Data Entry Data Owner (Affiliation) Data Name Experiment ID Description	単位	価1 2023-10-02 JST Keiichi Nakamoto (分子科学研究 所) Au Surface on Mica
データ所有者(所属) Keiichi Nakamoto (分子科学研究所) 試料名(ローカルJD) Sputtered Au thin film on Mica 説明	2 00um	×夕情報 分類 基本情報 読置情報	日本語名 記入年月日 データ所有包(所篇) データ名 実験ID 説明 登録名	英語名 Date of Data Entry Data Owner (Affiliation) Data Name Experiment ID Description Registration Name	単位 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3	値1 2023-10-02 JST Kelichi Nakamoto (分子科学研究所) Au Surface on Mica I C ビース会研究主義電子課時鏡
データ所有者(所属) Keiichi Nakamoto (分子科学研究所) 試料名(ローカルJD) Sputtered Au thin film on Mica 説明	2 00um	× 夕情報 分類 基本情報 読置情報	日本語名 記入年月日 データ所有包(所電) データ名 実験ID 設算名 電算名	英語名 Date of Data Entry Data Owner (Affiliation) Data Name Experiment ID Description Registration Name Organization	¥Ф 	個1 2023-10-02 JST Kelichi Nakamoto (分子科学研究所) Au Surface on Mica
デー夕所有者(所属) Keiichi Nakamoto (分子科学研究所) 試料名(ローカルID) Sputtered Au thin film on Mica 説明	2 00um	メク情報 ^{分類} 基本情報 読置情報	日本語名 記入年月日 記入年月日 プーク所特省(所篇) プータ名 実験1D 説明 鍵編名 融端 説明	英語名 Date of Data Entry Data Owner (Affiliation) Data Name Data Name Experiment ID Description Registration Name Organization Description	単位 	個1 2023-10-02 JST Keiichi Nakamoto (分子科学研究所) Au Surface on Mica
データ所有者(所属) Keiichi Nakamoto (分子科学研究所) 試料名(ローカルID) Sputtered Au thin film on Mica 説明	2 00um	× 夕情報 分類 基本情報 読置頃報 試料機報	日本語名 記入年月日 データ所有者(所篇) データ名 実験ID 認明 会課名 観聞 説明 試料名(ローカルID)	英語名 Date of Data Entry Data Owner (Affiliation) Data Name Experiment ID Description Registration Name Organization Description Sample Name (Local ID)	単位 	信1 2023-10-02 JST Kelichi Nakamoto (分子科学研究所) Au Surface on Mica Au Surface on Mica 位 位 公

3. 試料情報の確認・編集

試料詳細の編集画面へのアクセス 3-5

- ブラウザのアドレスバーでURL末尾の「? is NewTab=true」を削除し、キーボード のEnterキーを押す。 •
- 「編集ボタン」をクリック

😋 rde-ma	terial.nims.go.	p/samples/samples/11de	5be7-1e4c	-49ee-bb3f-ba4	2fe2da726 <mark>?</mark> isN	ew Tab= true
試料詳細				「 を	<mark>?isNewTab</mark> ⁼ 削除してEr	true
試料情報	試料ID	11de5be7-1e4c-49ee-bb3f-ba42fe2	2da726			
			\mathbf{V}			
試料詳細						
				編集	削除	戻る
試料情報	編集ボタ 下記権 ・試料 ・研究	ンが表示ない場合は 限を持つアカウント 管理者 チーム管理者(また	t、 、でRDE(こは代理	にログインし)	、てください	·`。
化学式・	試料名(ローカルID) 組成式・分子式など 試料管理者(所属)	Sputtered Au thin film on Mica Keiichi Nakamoto (分子科学研究所)		[戻る]を 試料一覧(クリックす 3-7)が表示	ると、 うされます。

試料編集 3-6

編集後、画面ト部の保存ホタンをクリ、

料編集	
科情報入力	
試料ID	11de5be7-1e4c-49ee-bb3f-ba42fe2da726
武料名の他、 材 分子式など、(t	料が適切に同定できる情報(化学式・組成式・ 合物名等)が記載されていること。
試料名(ローカルID) (ある)	Sputtered Au thin film on Mica
	試料名を追加
化学式・組成式・分子式など	化学式・組成式・分子式などを自由入力してください。
試料の説明	$B I H 66 \coloneqq \equiv \mathscr{O} \mathbf{O}$
	金スパッタ膜 スパッタ条件
	Po 100W
	保存 戻る

3. 試料情報の確認・編集

3-7 試料一覧画面

- RDEシステム上部の [利用方法] をクリック
- 試料管理の [ログイン] をクリック
- 試料一覧で [検索ボタン] をクリック

	回 DICE ログアウト
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RDEサイトマップ	
サービスの利用	
 試料管理 ○ ログイン 	
武料一覧	
試料名、タグ、説明、化学式・組成式・分子式などを入力してください。 Q	
 以下が表示対象となります ・自身が試料管理者の試料 ・研究チーム管理者(また) 自身の研究グループ内の 	-。 ↓ こは代理)の場合は、 ○試料